

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일
2012년 5월 31일 (31.05.2012)



(10) 국제공개번호
WO 2012/070910 A2

- (51) 국제특허분류:
G06F 19/00 (2011.01) *G06F 17/18* (2006.01)
- (21) 국제출원번호: PCT/KR2011/009067
- (22) 국제출원일: 2011년 11월 25일 (25.11.2011)
- (25) 출원언어: 한국어
- (26) 공개언어: 한국어
- (30) 우선권정보:
10-2010-0119228 2010년 11월 26일 (26.11.2010) KR
- (72) 발명자; 겸
(71) 출원인: 구홍섭 (KOO, Heung Seob) [KR/KR]; 충청북도 청주시 상당구 금천동 장자마을 8단지 부영아파트 808-401, 360-780 Chungbuk (KR).
- (74) 대리인: 유성우 (YOU, Sung Woo); 서울특별시 강남구 역삼1동 832-41 현죽빌딩 13층, 135-936 Seoul (KR).
- (81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ,

EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

- (84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

공개:

- 국제조사보고서 없이 공개하며 보고서 접수 후 이를 별도 공개함 (규칙 48.2(g))

(54) Title: REPRESENTATIVE-VALUE CALCULATING DEVICE AND METHOD

(54) 발명의 명칭: 대표값 산출 장치 및 방법.

(57) Abstract: Provided is a representative-value calculating device for calculating a representative value of process condition values by using values of process conditions measured in a process system. The representative-value calculating device according to an embodiment of the present invention calculates a median and a median absolute deviation (MAD) of process condition values at each sampling point by using the process condition values measured for each sample at each sampling point through a sensor; calculates a standardized value by using the process condition values, the median, and the MAD; and calculates a representative value of the process condition values for each sample on the basis of the calculated standardized values.

(57) 요약서: 공정 시스템 등에서 측정된 공정 조건에 대해 값들을 이용하여 공정 조건 값들의 대표값을 산출하는 대표값 산출 장치가 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 대표값 산출 장치는 센서를 통해 각각의 샘플마다 샘플링 포인트별로 측정된 공정 조건 값들을 이용하여, 각 샘플링 포인트별로 공정 조건 값들의 중앙값(median) 및 중위절대편차(median absolute deviation; MAD) 등을 연산하고, 공정 조건 값들, 중앙값(median) 및 중위절대편차(median absolute deviation; MAD)를 이용하여 표준화 값을 연산하고, 연산된 표준화 값들에 기초하여 각 샘플별로 공정 조건 값들의 대표값을 연산할 수 있다.



WO 2012/070910 A2